

Статьи и материалы, опубликованные в журнале “ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес” в 2019 году

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Р. Ромашко, В. Ежов.** ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MOLEX ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БУДУЩЕГО № 7, с. 66
ETHERNET – КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 8, с. 96

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- Ю. Ковалевский.** ПОДГОТОВКА К ВЗЛЕТУ. ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2018» № 1, с. 48
В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский, В. Мейлицев. ELECTRONICA 2018. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 2 № 2, с. 38
В. Ежов. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАССИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ № 3, с. 44
В. Ежов, Ю. Ковалевский. ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 3 № 3, с. 50
В. Ежов, Н. Елисеев, В. Мейлицев. ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 4 № 4, с. 28
Ю. Ковалевский. II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭКБ И МАТЕРИАЛОВ В РЭА ВВСТ № 5, с. 50
Ю. Ковалевский. КАК УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ЭКБ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ. III НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФГУП «МНИИРП» «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ – ЕДИНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО» № 6, с. 52
Ю. Ковалевский. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС. VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ» № 6, с. 56
В. Ежов. КАК СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 6, с. 58
Ю. Ковалевский. СВК КАК ОСНОВА УСКОРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 9 МРГ ПРИ КОЛЛЕГИИ ВПК РФ И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЭА И ЭКБ АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» № 7, с. 34
Ю. Ковалевский. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКБ: СЛОЖНОСТИ НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗОЙ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» № 8, с. 32
Ю. Ковалевский. КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» № 9, с. 36
В. Мейлицев. ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ СБОРКИ И КОРПУСИРОВАНИЯ. III ЕЖЕГОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГК «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ» «ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ СБОРКИ И КОРПУСИРОВАНИЯ» № 9, с. 42

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- Д. Кострин, В. Симон, Н. Потрахов, А. Ухов.** КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 10, с. 96

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

- Кс. Биньяле.** ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ № 2, с. 92
Ю. Асангханва, Р. Ий, А. Сыров. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЧНЫХ УЗЛОВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСХЕМ AT6CC608A КОМПАНИИ MICROCHIP № 7, с. 60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- М. Макушин, А. Фомина.** АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 5G-СЕТЕЙ № 6, с. 100
А. Бороздин. СИСТЕМА СВЯЗИ КВ- И МВ-ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ № 6, с. 114
И. Коптелов, С. Назаров, М. Ермолова. ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ВИРТУАЛИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ВИРТУАЛИЗАЦИИ «ГОРИЗОНТ-ВС» № 8, с. 76

КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- № 4, с. 16; № 5, с. 21
В. Шпак. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ – НЕ ПРИХОТЬ, А ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ № 6, с. 22
С. Попов. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СТАНУТ ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ РЫНКА. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА № 7, с. 22
№ 8, с. 18, № 9, с. 18; № 10, с. 19

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- Дж. Инь.** В ОБЛАСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ЕСТЬ СВОЙ «ЗАКОН МУРА» № 1, с. 12
Э. Халтен. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ С МОМЕНТА «РОЖДЕНИЯ» ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ № 1, с. 18
С. Довгучиц. ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОПК № 2, с. 12
П. Куцко. МНИИРП ДОЛЖЕН СТАТЬ ОТРАСЛЕВЫМ ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ № 2, с. 18
Д. Лобзов. ВОЗМОЖНОСТИ САПР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОВРЕМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 3, с. 12
Т. Катлер. КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ МОДЕЛИРОВАНИЕМ И ТЕСТИРОВАНИЕМ № 3, с. 20
Р. Мангушева. ВЫСТАВКИ КАК ЗЕРКАЛО РЫНКА И ЦЕНТР КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА № 3, с. 24

Статьи и материалы, опубликованные в журнале "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес" в 2019 году

- С. Данасекаран.** ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, КОМПАНИЯМ НУЖНЫ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, А ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ № 4, с. 10
- Р. Вага.** МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ ДЕЛАЕТ РЕНТГЕН ПОДЧАС НЕЗАМЕНИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА № 5, с. 12
- В. Кожин.** ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРЕБУЕТ НОВОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ № 6, с. 12
- В. Беспалов.** ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО ВУЗУ НЕОБХОДИМА РАЗВИТАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА № 7, с. 10
- Е. Иванова.** SYNOPSIS: ТRENДЫ, РЕШЕНИЯ, МИФЫ № 7, с. 16
- Е. Липкин.** «ИНДУСТРИЯ 4.0». ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ В ЦЕХАХ, А НЕ В КАБИНЕТАХ НАЧАЛЬНИКОВ № 8, с. 12
- А. Кищинский.** МЫ ВИДИМ, ЧТО МОЖЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ НА РАВНЫХ № 9, с. 10
- А. Роман.** СИНЕРГИЯ ПОСТАВОК И ИСПЫТАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ № 10, с. 12

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

- С. Фролова, Ф. Путря.** СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА HAPS КОМПАНИИ SYNOPSYS. ЧАСТЬ 1 № 4, с. 76
- С. Фролова, Ф. Путря.** СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА HAPS КОМПАНИИ SYNOPSYS. ЧАСТЬ 2 № 5, с. 120
- Н. Нагаев.** КОРПУСА ДЛЯ МИКРОСБОРОК КОМПАНИИ АО «ЭПП» № 6, с. 136
- А. Щербина, Л. Федорович.** ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, НИТРИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА БЕРИЛЛИЯ ОТ АО «ТЕСТПРИБОР» № 7, с. 106
- О. Баринова.** КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ К ПРОИЗВОДСТВУ № 8, с. 118

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

- Ш. Кацав.** КОМПАНИЯ TAVOR ELECTRONICS – ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ СИГНАЛАМИ № 1, с. 118
- А. Кривов, Е. Смирнова, К. Бондин, П. Николаев.** НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТРОЛОГИИ № 2, с. 58
- Б. Дерат, К. Роузлл, А. Танкелюн, С. Шмитц.** ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ИЗМЕРЕНИЯМ В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G № 2, с. 66
- А. Шостак, Д. Кондрашов, Э. Сутау, М. Крейтлоу.** БЫВАЮТ ЛИ ОСЦИЛЛОГРАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ? № 2, с. 72
- А. Крылов.** ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫХ УЗЛОВ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ № 2, с. 76

- В. Быканов, Б. Подъяпольский, В. Булгаков.** НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКБ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ № 3, с. 112
- В. Гречишников, А. Курицкий, А. Бутько, А. Иванов.** ПЕРИФЕРИЙНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НЕ ТОЛЬКО: JTAG-ЛАБОРАТОРИЯ В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ № 3, с. 120
- Ю. Иванов, А. Никонов, Э. Князева.** ИЗМЕРЕНИЕ С-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КВАРЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ № 3, с. 124
- В. Быканов.** СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 4, с. 102
- С. Веденников.** МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА № 4, с. 108
- Д. Кондрашов, А. Шостак, П. Дейкстра.** ИСПЫТАНИЯ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ № 4, с. 112
- Б. Лапшинов, Н. Тимченко.** МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ № 5, с. 90
- А. Смирнов.** ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ПЛОСКОГО ПОЛЯ ТИПА СТЕМ-КАМЕР ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ № 6, с. 80
- Ю. Синельников.** УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ СВЧ-ФОТОДИОДОВ № 6, с. 84
- М. Соковишин, С. Литвиненко.** ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ V2X И ИХ РЕШЕНИЯ № 6, с. 92
- М. Писковацков.** ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ITECH IT6000C ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИЖИТЕЛЯ С ЭФФЕКТОМ ХОЛЛА № 8, с. 74
- Н. Лемешко, П. Струнин.** МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДАТЧИКОВ ХОЛЛА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИХ МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ ROHDE&SCHWARZ № 9, с. 104
- Я. Россоский.** ОСЦИЛЛОГРАФЫ АКИП-4133 И АКИП-4133/1 С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 16 ГГц. ЧАСТЬ 1 № 10, с. 102
- МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ**
- А. Сафонов.** МАТРИЧНЫЕ КМОП-ФОТОПРИЕМНИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ № 2, с. 140
- МИКРОМОДУЛИ И МИКРОБЛОКИ**
- М. Шкопкин, Ю. Мякочин, С. Девликанова.** МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МИКРОСБОРОК НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОСХЕМ № 2, с. 136
- П. Верник.** ПУТЬ К СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ РАЗРАБОТКИ И ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДОВОЙ ЭКБ: СВК НА ОСНОВЕ LTCC № 3, с. 170
- А. Хохлун, С. Чигиринский.** КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ФЛИП-ЧИП» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ В КОРПУСЕ № 3, с. 174

Статьи и материалы, опубликованные в журнале “ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес” в 2019 году

В. Мейлицев. 4,5 МЕСЯЦА ОТ ИДЕИ МИКРОМОДУЛЯ
ДО ГОТОВОГО ОБРАЗЦА № 5, с. 114

А. Щербина. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОСБОРОК
НА МНОГОСЛОЙНОЙ КЕРАМИКЕ № 9, с. 90

В. Жалнин, А. Трифонов, Т. Цивинская. ВЫБОР
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОРПУСИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-
СТОЙКОЙ МЕМРИСТОРНОЙ ПАМЯТИ № 10, с. 124

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПЛИС

А. Петров, Д. Потехин, И. Тарасов. ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ НА БАЗЕ ПЛИС В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ № 1, с. 112

П. Ван. ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ IoT № 4, с. 42

В. Ежов. СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ SmartFusion2
OT MICROSEMI: ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ № 4, с. 46

А. Строгонов. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПЛИС № 4, с. 52

И. Тарасов. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИС КЛАССА «СИСТЕМА НА
КРИСТАЛЛЕ» XILINX ZYNQ И ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВ ОПИСАНИЯ АППАРАТУРЫ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ № 4, с. 62

Л. Ди Джасио. КАК С ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ ЯДРА
ПЕРИФЕРИИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ PIC СИНТЕЗИРОВАТЬ
НОВУЮ ФУНКЦИЮ № 4, с. 68

А. Строгонов, С. Цыбин, П. Городков. МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПЛИС СО СТАТИЧЕСКИМ ОЗУ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ № 5, с. 98

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
ДИСКУССИОННЫЙ БАТЛ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ В РАМКАХ ВЫСТАВОК ExpoElectronica
И ElectronTechExpo 2019 № 6, с. 42

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА:
НАСКОЛЬКО ВЕРНЫ СТЕРЕОТИПЫ № 10, с. 34

НАДЕЖНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ

М. Макушин, В. Мартынов. НАДЕЖНОСТЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ИС: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ № 1, с. 146

М. Макушин, В. Мартынов. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
И ВЫХОДА ГОДНЫХ: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ № 5, с. 56

**С. Аваков, В. Матюшков, А. Вискушенко,
А. Казаков.** ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ
И НАНОДИАГНОСТИКИ СПЕЦТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ОЛИН СТО) № 5, с. 68

С. Доцник, А. Ефремова. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЛЕСНЕВЫХ
ГРИБОВ № 5, с. 74

А. Петровичев. ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ HIRF-ПОЛЕЙ № 5, с. 80

Д. Кондрашов, А. Шостак. СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА
ЭМС МИКРОСХЕМ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ № 5, с. 84

П. Гребенщиков. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ № 6, с. 172

Р. Порядин. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ. БОРЬБА
С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ № 7, с. 144

А. Грибин. КОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА АО «ЗПП»
ДЛЯ ЭКБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА № 7, с. 152

А. Гербин. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРЕННЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЭКБ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА –
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ № 9, с. 136

Е. Фёдоров. ЭКРАНИРОВАННЫЕ И БЕЗЭХОВЫЕ КАМЕРЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ЭМС № 9, с. 142

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Е. Луковка. ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 5, с. 152

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

Э. Чу. КОМПАНИЯ DELSON TECHNOLOGY: ШИРОКИЙ ВЫБОР
ПАМЯТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ № 1, с. 70

Б. Беленький. НИИ «ГИРИКОНД» – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ... (К 80-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ) № 3, с. 86

А. Насонов. НАДО ВЕРИТЬ В СЕБЯ И МНОГО РАБОТАТЬ,
И ТОГДА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ № 10, с. 40

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

П. Григорьев, Т. Шимчук, Т. Цивинская. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЯМОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ОТВЕРСТИЙ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 2 № 1, с. 128

А. Генцелев. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ № 1, с. 138

П. Григорьев, С. Милешин, Т. Цивинская. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ КОМПАУНДОМ СИЭЛ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЭМС-СЕНСОРОВ № 4, с. 132

С. Никитин, К. Поздняков, О. Хомутская. ОЦЕНКА
ДЕФОРМАЦИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ № 5, с. 144

В. Иванов. ХЛОРИРОВАНИЕ В СОЛЕВОМ РАСПЛАВЕ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ № 6, с. 154

Д. Суханов, В. Команов. ГЕТЕРОГЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ ГРУППОВОЙ СВАРКИ КРИСТАЛЛ-ПЛАСТИНА –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К 3D-ИНТЕГРАЦИИ
МИКРОСХЕМ № 6, с. 162

С. Ванцов. СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОТВЕРСТИЙ В ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ	№ 6, с. 168
Д. Максимов. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ НА ВАКУУМНУЮ ПЛОТНОСТЬ ПЯННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	№ 7, с. 110
О. Боброва, Д. Мануков. 3D-ПЕЧАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	№ 7, с. 114
И. Григорьев, Т. Михайлова, Т. Мясоедова. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР	№ 9, с. 96

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

О. Ковалевский, В. Мейлицев. КОРПУСА ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ. ВИЗИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ «ТЕСТПРИБОР»	№ 1, с. 58
О. Ковалевский, В. Мейлицев. ПОЛНЫЙ ЦИКЛ, МИРОВОЙ УРОВЕНЬ. ВИЗИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «ДИАКОНТ»	№ 3, с. 74
В. Мейлицев. В ПЕРСПЕКТИВЕ МЫ ВИДИМ СЕБЯ В РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ВИЗИТ НА АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД	№ 6, с. 62
В. Мейлицев. КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ. ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ. ВИЗИТ В ООО «МикроЭМ ТЕХНОЛОГИИ»	№ 7, с. 40
В. Мейлицев. ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КРАТНОГО СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ: СИСТЕМА В КОРПУСЕ НА ОСНОВЕ LTCC. ВИЗИТ В НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СпецЭлектронСистемы»	№ 8, с. 34
О. Ковалевский, О. Саликова. ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОСОБЕННО, КОГДА ОНИ ЕСТЬ. ВИЗИТ В ООО «САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛМА»	№ 9, с. 44
О. Ковалевский. ГИБКОСТЬ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ДИЛЕММА РАЗРЕШИМА? ВИЗИТ НА СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «НАНОТЕХ»	№ 9, с. 54

СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА

В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий, Г. Алексеев. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СВЧ-АТТЕНЮАТОР, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО МОСТОВОЙ СТРУКТУРЕ	№ 2, с. 116
В. Кочемасов, Т. Косичкина. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ ДОГЕРТИ. ЧАСТЬ 1	№ 3, с. 144
К. Джуринский, С. Павлов, О. Морозов. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ШИРОКОПОЛОСКОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН	№ 3, с. 154
В. Кочемасов, Т. Косичкина. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ ДОГЕРТИ. ЧАСТЬ 2	№ 4, с. 118
А. Коренев. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНО- МИКРОПОЛОСКОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ТИПА SMP	№ 5, с. 106

Г. Алексеев, А. Калёнов, И. Мухин, В. Репин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДИСКРЕТИЗАЦИЕЙ И КВАНТОВАНИЕМ ДЛЯ СВЧ АЦП	№ 6, с. 72
А. Бугаев, Ю. Ковалевский. РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MINI-CIRCUITS: ОТ ВЫБОРА СВЧ-КОМПОНЕНТА ДО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ	№ 6, с. 76
А. Аредов. МИКРОСХЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ ДО 6 ГГц СО ВСТРОЕННЫМ ГУН	№ 7, с. 92
К. Гомес-Дуарте, А. Лезинов. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАКАЗНЫХ SMT-КОРПУСОВ ДЛЯ ИС МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН	№ 7, с. 98
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 1	№ 8, с. 108
К. Джуринский, В. Батаев. СОЕДИНИТЕЛИ 1.35 mm ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0–90 ГГц	№ 8, с. 114
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 2	№ 9, с. 116
К. Джуринский. ЭВОЛЮЦИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ И СОТОВОЙ СВЯЗИ	№ 10, с. 74
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 3	№ 10, с. 82
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА	
О. Пчельникова-Гротова. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ АВТОНОМНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК	№ 1, с. 120
О. Пчельникова-Гротова, А. Иванов, В. Латыпов. УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ	№ 2, с. 120
Е. Рабинович. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ TDK-Lambda СЕРИИ GXE: УПРАВЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОНСТРУКТИВЕ	№ 2, с. 128
Ф. Досталь. СНИЖЕНИЕ ПОМЕХ В СИНХРОННЫХ ПОНИЖАЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИОДА ШОТКИ НА ПРИМЕРЕ ADP2443 ОТ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES	№ 5, с. 112
Т. Брэнд. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДРАЙВЕРОВ ЗАТВОРА МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ	№ 7, с. 88
М. Савин, С. Абрамов. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАНАРНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	№ 8, с. 40
Ф. Досталь. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ОТКРЫТИЯ КЛЮЧЕЙ В СИНХРОННЫХ ПОНИЖАЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ФРОНТОВ ИМПУЛЬСОВ	№ 8, с. 46
М. Макушин. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ	№ 8, с. 50

Х. Куек, А. Буквин. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ПОМЕХИ ИМПУЛЬСНЫХ ИВП НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА И ТЕХНОЛОГИИ SILENT SWITCHER	№ 8, с. 58
У. Ву. КАК ВЫБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВЫХ ТОКОВ И ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ	№ 8, с. 62
В. Ежов. РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MORNsun ДЛЯ СИСТЕМ ПИТАНИЯ В УМНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ	№ 8, с. 68

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С. Кокин, В. Перминов, С. Волков, С. Морозов. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЗЧ В САПР «КИПАРИС»	№ 3, с. 92
Ж.-Ф. Бинуа, С. Белоусов, Ю. Ковалевский. СРЕДСТВА СТАТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ SpyGlass И VC LP. ПОИСК ОШИБОК НА УРОВНЕ RTL	№ 3, с. 98
В. Ежов. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕБУЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ «ПСБ СОФТ»	№ 3, с. 104
С. Белоусов. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЗЧ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПЛИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА SYNPLIFY PREMIER	№ 4, с. 82
М. Макушин, А. Фомина. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ САПР	№ 4, с. 90
Д. Лобзов, А. Лохов. РЕШЕНИЯ MENTOR, A SIEMENS BUSINESS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 1	№ 5, с. 126
А. Глинкин, К. Никуев, Б. Филипов. РЕШЕНИЯ MENTOR, A SIEMENS BUSINESS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 2	№ 6, с. 140
А. Петровичев. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	№ 8, с. 122
Ю. Леган. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. ЧАСТЬ 1	№ 10, с. 130

СОБЫТИЕ НОМЕРА

В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский. ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 1	№ 1, с. 34
О. Казанцева. РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 5, с. 22
Ю. Ковалевский. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ОПК И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ	№ 6, с. 18

СХЕМОТЕХНИКА

С. Пескова. УБИТЬ USB-КИЛЛЕРА	№ 2, с. 102
А. Воронин. СТРУКТУРА КАНАЛОВ ДЛЯ СЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ	№ 2, с. 106
А. Воронин. ШУМОВЫЕ СВОЙСТВА И ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ КАНАЛА СЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ	№ 10, с. 114

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

А. Калмыков, В. Мейлицев. КАЧЕСТВО ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЗАЦИЮ: ТРАФАРЕТНЫЙ АВТОМАТ G-TITAN КОМПАНИИ СКГ	№ 3, с. 184
А. Алексеев, С. Петров, Е. Чукавов. ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА РАЗРАБОТЧИКОВ СТО И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКБ	№ 3, с. 190
Д. Поцелуев. МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЫ, НО И ЗНАНИЯ, И ТЕХНОЛОГИИ	№ 5, с. 134
Г. Степанищев. ПРЕЦИЗИОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКИХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ NORDSON EFD	№ 5, с. 142
С. Шиляев, С. Постнов. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ АРГОНОВОЙ СВЧ-ПЛАЗМОЙ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	№ 6, с. 150
Е. Астахов, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, С. Горобец. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 7, с. 128
Н. Левкина, А. Медведев. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ	№ 7, с. 134
Ш. Сарновски. «ЛИСА», «ПУМА», «ТАРАНТУЛ»: ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ ПОЧТИ КАК В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ	№ 8, с. 126
Е. Астахов, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, С. Горобец, А. Дымова. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 8, с. 130
А. Завалко. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ: КАК УСКОРИТЬ ВЫВОД НА РЫНОК СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	№ 9, с. 66
М. Макушин, В. Мартынов. ОСВОЕНИЕ EUV-ЛИТОГРАФИИ В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ	№ 9, с. 70
С. Аваков, В. Плебанович, А. Лапко. ГЕНЕРАТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ БЕЗМАСКОВОЙ ЛИТОГРАФИИ	№ 9, с. 80
Д. Поцелуев. ВЛАГОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ: ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ	№ 9, с. 86

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А. Генцелев. СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	№ 3, с. 180
---	-------------

- Р. Ромашко, В. Ежов.** ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ HARTING ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: КОГДА ЗАКАЗЧИК СТАНОВИТСЯ ПАРТНЕРОМ № 9, с. 132
- Д. Чернов.** ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОДНОГО ПРОЦЕССА, ИЛИ КАК ОЦИФРОВАТЬ РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 10, с. 136

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

- Н. Кульчицкий, А. Наумов, В. Старцев.** РЫНОК НЕОХЛАЖДАЕМЫХ МИКРОБОЛОМЕТРОВ ДЛЯ ИК-КАМЕР: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ № 1, с. 156
- М. Макушин, А. Фомина.** ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ КНР № 2, с. 158
- А. Фомина.** РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 4, с. 140
- Ю. Ковалевский, Е. Суворов.** РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ В СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ: ОТЧЕТЫ Yole Développement № 5, с. 156
- В. Разумов.** ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ ФОНДА: ТАК ЛИ ЭТО СЛОЖНО, КАК КАЖЕТСЯ? № 6, с. 176
- Н. Тюрнев.** ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ № 7, с. 158
- М. Макушин, А. Фомина.** ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ КНР И ТАЙВАНИЯ № 7, с. 160
- Г. Левин.** ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МФППИП. РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ № 8, с. 136
- А. Фомина.** ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ № 8, с. 140

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

- М. Самойлова.** ЩЕЛК, И ГОТОВО! МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ODU-MAC® BLUE-LINE № 10, с. 62
- Р. Ромашко, В. Ежов.** ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ТРЕБУЮТ УМНЫХ РЕШЕНИЙ: КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛИ MOLEX ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ДАТА-ЦЕНТРАХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ № 10, с. 68

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

- М. Макушин, И. Черепанов.** НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫХ № 1, с. 74
- В. Осипов.** ПРИМЕНЕНИЕ СНК 1879ВЯЯ В КАЧЕСТВЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО АМПЛИТУДНОГО АНАЛИЗАТОРА ЦИФРОВОГО СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ТРАКТА № 1, с. 82
- Г. Алексеев, В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий.** ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 8-РАЗРЯДНЫЙ БИКМОП АЦП № 1, с. 88
- В. Ежов.** АЦП И ЦАП ANALOG DEVICES: ОБЗОР НОВИНК 2018 ГОДА № 1, с. 92
- В. Ежов.** МЭМС-ДАТЧИКИ MURATA: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ № 1, с. 104
- Дж. Стивенсон, О. М. Азиз.** PULSE ELECTRONICS: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ № 2, с. 96

- П. Пастухов.** СИНХРОННОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ОЗУ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА № 3, с. 130
- В. Громов, Н. Брюхно, В. Стрекалова, Т. Паньков, С. Алёхин.** НОВАЯ СЕРИЯ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» № 3, с. 138
- О. Конц, А. Фадеева.** НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ОТ Würth Elektronik: ВСЁ МЕНЬШЕ МЕСТА ДЛЯ «МАГИИ» В ЭЛЕКТРОНИКЕ № 5, с. 102
- В. Смирнов, А. Харитонов, А. Шалаева, А. Сак.** ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ Б33 ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА № 6, с. 120
- В. Кочемасов, С. Хорев.** КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ. ЧАСТЬ 1 № 6, с. 128
- А. Щепанов.** РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА № 7, с. 74
- В. Кочемасов, С. Хорев.** КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ. ЧАСТЬ 2 № 7, с. 78
- М. Соколов, В. Ежов.** ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ WIMA: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ № 8, с. 102
- М. Макушин, И. Черепанов.** СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНДЕНСАТОРОВ № 10, с. 50
- Н. Брюхно, В. Громов, М. Котова, Ю. Севастьянов, В. Стрекалова, В. Пугачев.** ДИСКРЕТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ № 10, с. 56

ЭЛЕКТРОНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- А. Брыкин.** УСТРАНЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ПРИ ЗАКУПКЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ № 7, с. 48
- И. Корнеев, В. Польщиков, А. Шилов.** НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГЛОНАСС / GPS / GALILEO НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК ПРО-04 № 7, с. 52
- Т. Гужкова, А. Раскин.** НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НА БАЗЕ ПОЗИСТОРОВ № 7, с. 56
- Ю. Мякочин, М. Бирюков.** МИЛЛИМЕТРОВЫЕ РАДАРЫ АО «ПКК МИЛАНДР» ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТЕ И В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ № 8, с. 90

Санкт-Петербург, Россия
ул Матроса Железняка,
д. 57, лит. А, пом. 126-Н
Телефон: 7-812-3259792

Москва, Россия
Лужнецкая набережная, 2/4,
строение 19, офис 119
Телефон: 7-095-7477590



Поставки электронных компонентов
широкой номенклатуры
Системы RFID: поставка и консультации

